[14B-01]

SIGNAL PROCESSOR FOR BPM USING LOG AMPLIFIRE-DETECTOR

 K. Yanagida^{*)}, T. Asaka, H. Hanaki, T. Hori, T. Kobayashi, A. Mizuno, S. Suzuki, T. Takashima and T. Taniuchi
Japan Synchrotron Radiation Research Institute, Accelerator Division, Kouto 1-1-1, Mikazuki-cho, Sayo, Hyogo, 679-5198 Japan

ABSTRACT

A signal proseccor of the single shot BPM system has been developed at the SPring-8 linac. The latset design of an each signal processor is composed of a narrow-band BPF, a logarithmic detector amplifier, a peak hold circuit and a 16bit ADC. As a result of the test for a protetype, resolution was several micrometers and an input current range was 0.2~50mA for 40ns pulse beam, 10mA~2.5A for 1ns pulse beam.

対数増幅検波回路を用いたBPM信号処理回路

1.はじめに

SPring-8線型加速器では平成7年頃よりビーム位 置モニタ(BPM)システムの設計・開発を行って いる。BPM本体は信号強度の大きな静電型ストリッ プラインモニタとし、シングルパルス、1ns、40ns 及び1µs等様々なビームパルス幅に対応するため、

検波周波数を2.856GHz、即ちストリップライン長を27mmとした。平成10年度にBPM本体の試作を行い、試験の結果が良好であった 32mmBPM を平成11年度中に発注した。これら 32mmBPMは平成12年度夏期停止期間中に設置される。

一方、信号処理回路は、検出するビーム電流範 囲が広いことから、ダイナミックレンジの大きな LOG演算方式を採用することにした。平成11年度 に試作機の製作を行い、ベンチ試験および実ビー ム試験を行った。その結果、十分な性能が得られ たとして、VMEと接続可能な実機対応型の信号処 理回路を現在製作中である。本研究会ではこの信 号処理回路の設計および試験結果について述べる。

2.信号処理回路試作機の設計

図1は実機対応型信号処理回路のブロックダイ アグラムである。グレーで囲まれた部分は今回試 験を行った試作機分である。BPF(バンドパスフィ ルタ)モジュール及びディテクタモジュールは共 にNIM2幅のモジュールであり、各々4チャンネル 分の回路及び入出力を有する。

BPM本体から出力された信号は約20mの同軸ケー ブルで伝送された後、BPFモジュールへ入力される。 BPFモジュール中には、2空胴型のBPFユニットが 設置されている。中心周波数は2.856GHz(@25)、 バンド幅は10MHzである。このバンド幅は続く LOG増幅器ユニットの立ち上がり特性(40ns)[1] から必然的に決まる。BPFユニットではパルス幅の 短いRF信号を80ns以上へ引き延ばすのと同時に、 単一周波数化も行っている。

BPFモジュールから出力された信号はディテクタ モジュールの2.856GHzLOG増幅器ユニット(図2) へ入力される。このLOG増幅器ユニットは入力保



図1 DFM信号処理回路のフロックタイプクフム

⁾ K. Yanagida, 0791-58-0851, ken@spring8.or.jp



護用LCフィルタ(2.856GHz、バンド幅100MHz程度)、LOGディテクタ(ANALOG DEVICES社製AD8313)及びオフセット&ゲイン調整回路から成る。図3はLOG増幅器ユニットの出力信号波形である。この信号をセルフトリガによってピークホールド(P/H)し、サンプルホールド(S/H)したものを出力する。

3.信号処理回路試作機の試験

3.1 ベンチ試験

恒温槽を使用し、温度一定条件下及び温度変化 をさせた場合に就いてベンチ試験を行った。シン セサイザから出力されたCWの2.856GHzRF信号を LOG増幅器ユニットに入力し出力を測定した(図 4)。図中、Ch2の特性が大きくずれているのはオ フセット&ゲイン調整(固定抵抗と可変抵抗で調 整)を直線域から外れた-60dBm及び-20dBmで行っ た為である。

図5はスロープ[V/dBm]、即ち出力曲線の微係数 である。概ね0.021V/dBm程度でフラットトップを 形成している。LOGディテクタはIC内部に9個のディ テクタセル[1]を使用しており、ディテクタ切り替 えに因るスロープの段差が発生すると思われたが、 結果は小さく、数µ程度の分解能は可能だとわかっ た。

計算機による入出力補正(三次曲線で近似)を

行うと仮定すると、フラットトップの90%程度が実 用的なダイナミックレンジとなり、入力パワーで は-50dBm~-3dBmとなる。

図6はベンチ試験の結果から計算された測定可能なビーム(平均尖頭)電流を示している。但し、 ケーブルロスを含んでいない。図からシングルパルスビーム0.04~10A、1nsビーム0.01~2.5A、40ns ビーム0.2~50mA、1µsビーム0.07~18mAが測定可能な電流レンジであることがわかる。



図7はLOG増幅器ユニットの温度1 当たりの 出力変化率である。Ch1、Ch4の変化率が近く、 Ch2、Ch3の変化率が近い。これから、温度1 当 たりの位置のずれをログレシオ法[2]で計算すると、 X方向が10µmに対し、Y方向が2µmとなる。

一方、図8はBPFユニットの温度1 当たりの 出力変化率である。Ch3のみ特性がずれているのは、 調整時の温度が他のチャンネルのものと異なって いたと思われる。温度1 当たりの位置のずれを計 算すると、X方向及びY方向共に2µmとなる。

恒温槽を25 に設定してBPFユニットの中心周 波数を測定すると2.8564GHzであった。周波数の変 化率が-44kHz/ と測定されているのでBPFユニッ ト付近の温度は34 と云うことになる。これはBIN 電源等からの熱が伝導して入り込んでいる為であ る。



3.2 実ビーム試験

マシン運転環境下でのノイズレベル等を評価す るため、信号処理回路をクライストロン室に置き 実ビームのRF信号を入力して信号処理回路出力を 観測した。

図9はステアリング電磁石励磁電流を変化させた時にBPMからの信号を処理し、差分を取ったものである。X方向は直線的に変化しているのに対し、 Y方向は揺らぎを持って変化している。Y方向の変

化はステアリング電磁石及びBPMの基準面が完全 に一致していない為である。この揺らぎは位置に 換算すると =6.7µmである。この値はビーム自身 の揺らぎを示していると思われ、BPMシステム自



4.実機対応型信号処理回路の設計

基本的には試作機を踏襲し、その後段に差動増 幅器(BURR-BROWN社製INA106)を置く。差動増 幅器のオフセット電圧をDACで調節し、ケーブル・ コネクタ等に因って発生する減衰の個体差を吸収 する。最終段には16ビットADCを置き、VMEへの 出力はデジタル信号により取り合う。

5.まとめと今後の課題

LOG増幅器ユニットに就いて、ゲイン&オフセット調整は-45dBmと-15dBmの2点で行うのが適当であろう。スロープは0.0200V/dBmとする。温度変化の対策としては特性の揃ったものを4台選別して使用するのが適当であると考える。

BPFユニットに就いて、試作した2空胴型(バン ド幅10MHz)がスペクトルのフラットネス(図10 参照)から適当と考える。但し、4台のBPFの中心 周波数一致精度は0.1 で10kHz程度は必要である。 中心周波数は設置環境温度に合わせて調整する必 要がある。



参考文献

- [1] Data Sheet of AD8313, ANALOG DEVICES
- [2] F. D. Wells et al., "Log-Ratio Circuit for Beam Position Monitoring", AIP Conf. Proc. 229, p. 308 (1991)